



SEMICON China 2017 出展のご案内

この度中国現地法人と協力し、中国の幅広いお客様へ電子部品企業としてのブランディングを確立させるとともに、中国市場でのさらなる新規モデルテストの受注を推進させるため、『セミコンチャイナ 2017』に出展いたします。

弊社ブースでは、パワーデバイス測定ノウハウを継承し、かつVIソースメジャモジュールを取入れた、新しいコンセプトのDCテスト 431-TT の実機デモをご覧いただくとともに、ウエハ測定工程における複数チップ同時測定を実現した新しいコンセプトのDCテスト 471-TT の新戦略モデルをご紹介します。

ぜひとも弊社ブースにご光臨賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

敬具

会期：2017年3月14日(火)～16日(木)

会場：新国際国際博覧センター

ホール2 ブース No. 2775



431-TT



471-TT



お問い合わせ先

〒207-0023 東京都東大和市上台北台 3-391-1

株式会社テセック 営業統括部 王鉄成

Tel : 042-566-2111 Fax : 042-561-3519

E-MAIL: wang.tiecheng@tesec.co.jp

URL : <http://www.tesec.co.jp>

